



solver p47扫描探针显微镜功能简介

Scanning Probe Microscope solver p47 pro

一、主要功能及用途

在空气中：STM/低电流STM/扫描隧道谱/接触式；AFM/侧向力模式/振动模式（半接触AFM+非接触AFM）/相位成像模式/力调制模式/扩展电阻成像/磁力显微镜/静电力显微镜/扫描电容显微镜/扫描开尔文探针显微镜/粘附力成像/剪切力成像/刻蚀：AFM（力和电压），STM，RM。

在液体中：接触式AFM/侧向力成像模式/力调制模式/粘附力成像模式/半接触式（扫描器驱动）AFM/AFM（力）刻蚀。

二、主要技术指标

- 样品尺寸：** 40x40x10mm
- 扫描器：** 3x3x1um(± 10%);10x10x2um(± 10%);50x50x3 um(± 10%)
- 最小扫描步长：** 0.0004 nm;0.0011 nm;0.006 nm
- 扫描类型：** 样品扫描式
- S P M 头部：** AFM
STM:
30pA-50nA,4p时的ARMS噪音（标准的前置放大器），
10pA-5nA,1.5p时的ARMS噪音（低电流前置放大器）
剪切力
- 光学观察系统：** 数值孔径0.1
放大倍数58x to 578x
水平视野5.1~ 0.51mm
- 控制系统：** SPM控制箱
- 振动隔离系统：** 集成有被动隔离系统

三、主要特点

- 1、合理的操作模式。
- 2、集成测量头。
- 3、大样品也可以进行测量。
- 4、多样的图像处理方法。
- 5、在通常的实验室环境下就可以得到原子级图像。



产地：NT-MDT CO., Moscow, Russia

